

## JIS 見直し並びに JIS 確認及び廃止の申出に係る審議について

日本産業規格（以下、JIS という。）は、産業標準化法に基づき、JIS を制定又は確認若しくは改正した日から少なくとも 5 年を経過するまでに見直す必要があります。多数の JIS があることから効率的な運用のために、毎年度一括して JIS 見直しを行うこととしております。JIS の見直しの流れ及び産業標準作成委員会の審議方法は、別添 1 をご参照ください。

なお、別添 1 のとおり「JIS 作成予定一覧表の公表」、「利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保」及び「異議申立ての機会の確保及び廃止のみ意見受付公告」の過程で、利害関係者から意見等があった場合で、議決結果の変更又は意見等を採用しない場合は、再度、産業標準作成委員会にお諮りいたします。また、字句等編集上の修正については、事務局に一任いただきますようお願いいたします。

### （１）JIS 見直しの審議

2024 年度に見直し期限を迎える JIS について、当会にて関係各方面の意見を十分に調査し、別添 2 のとおり 2024 年度中に改正、確認又は廃止とするかの案を作成いたしましたので、ご審議をお願いいたします。ご承認いただいた JIS 見直しのうち、公示予定が「確認」、及び公示予定が「廃止」、かつ、これから廃止に着手する JIS については、その内容を利害関係者に公表するために JIS 作成予定一覧表として JSA ホームページに掲載いたします。

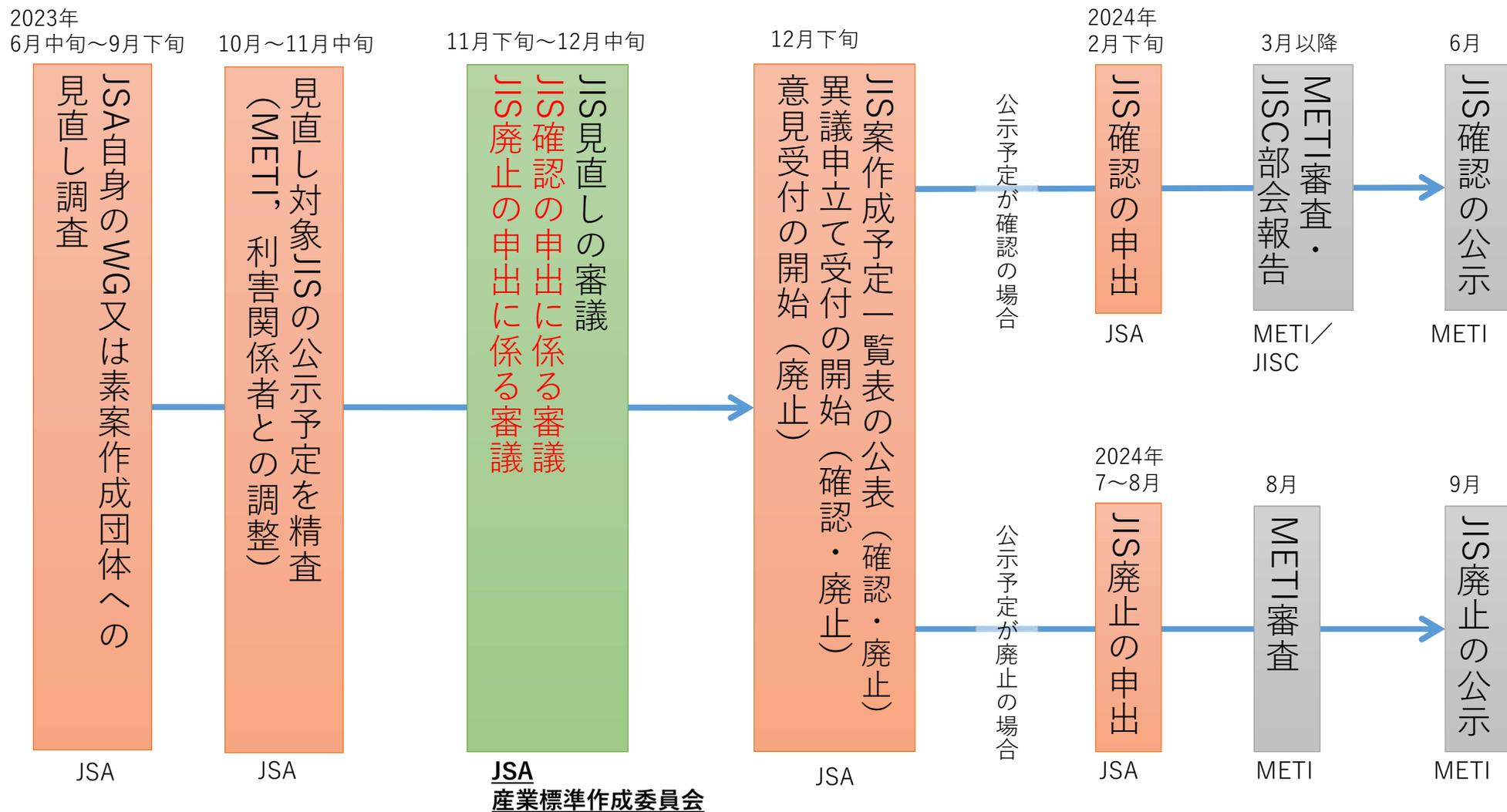
### （２）JIS 確認及び廃止の申出の審議

上記別添 2 に基づき、別添 3 及び別添 4【別添 3 が確認の作成審議経過報告書、別添 4 が廃止の作成審議経過報告書】に、2024 年度中の公示予定を「確認」又は「廃止」とする JIS 及び作成審議経過等を作成いたしました。申出前までに利害関係者からのご意見等がない場合は、公示予定が「確認」及び「廃止」について、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、主務大臣に申出してよろしいか、あわせてご審議をお願いいたします。

以上

# 別添1 : JISの見直しに関する審議

## (1) JIS見直しの流れ



## (2) JIS見直しの審議について

目的： 次年度に5年見直し期限を迎えるJISについて、「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの見直し方針を決定します。

1. 利害関係者の意見を確認するため、JSAが見直し対象のJISを抽出し、調査します。
  - ※ 見直し対象は、次年度に5年見直し期限を迎えるJISです。
  - ※ 技術的動向、対応国際規格や引用規格の改正・廃止などを背景に、JISを改正する必要があるのか、確認でよいのか、又は廃止するかなどを調査します。

## (2) JIS見直しの審議について (続き)

2. JSAが調査結果に基づき、それぞれのJISについて「改正」、「確認」又は「廃止」のいずれにするかの案（以下、JIS見直し案という。）を理由とともに作成します。

その際には、必要に応じて、JSA自身のWG又は素案作成団体に事実確認を行います。

その後、産業標準作成委員会にお諮りします。

※ 当該JISが次に該当し、次年度までに「改正」又は「廃止」の公示を予定している場合は、JIS見直し案を「改正」又は「廃止」とします。

※ 当該JISが次に該当し、これから改正又は廃止に着手するため、次年度までに「改正」若しくは「廃止」の公示ができない場合、又は次に該当しない場合は、JIS見直し案を「確認」とします。

改正又は廃止が必要な要因
市場実態又は技術動向に合わせ、最適な技術内容とすべく、規定内容の変更が必要
社会的要因で規定内容の変更が必要（環境問題など）
対応国際規格の改正又は廃止があり、規定内容の変更が必要
対応すべき国際規格が新たに制定され、それに整合することが必要
引用規格の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
引用すべきJISが新たに制定された
引用（参照）法規の改正及び/又は廃止があり、規定内容の変更が必要
引用（参照）すべき法規が新たに制定された
技術の陳腐化・利用の縮小等、JISの廃止が妥当

## (2) JIS見直しの審議について (続き)

3. 産業標準作成委員会でJIS見直し案をご審議いただきます。

### JIS見直し案：【別添2】

- ※ JIS見直し案の資料については、JSAで事実確認を行っております。
- ※ 対応国際規格などの改廃状況は、資料の参照文書（JSA調査結果）に記載しております。
- ※ ご承認いただいたJIS見直しのうち、公示予定が「確認」及び「廃止」のJISは、JIS作成予定一覧表としてJSAホームページに掲載します。  
(利害関係者に対する産業標準作成委員会への参加の機会の確保及び異議申立ての機会の確保のため)

### (3) JIS確認及び廃止の申出に係る審議

目的： 利害関係者の意向を適切に反映するためのプロセスを通し、  
主務大臣にJISの確認及び廃止の申出をしてよいかどうかを決定します。

1. JIS見直しの審議と同時に、JSAが作成審議経過報告書（確認及び廃止）（案）を作成します。

※ 当該報告書では、確認及び廃止の申出を行う対象JIS、確認及び廃止する理由、認定機関としてのプロセスの予定（JIS見直しの審議～JIS作成予定一覧表の公表結果（確認及び廃止）（予定）、並びに意見受付公告結果（廃止）（予定））を示しております。

2. 産業標準作成委員会で作成審議経過報告書（確認及び廃止）（案）に基づき、ご審議いただきます。

作成審議経過報告書：確認【別添3】、廃止【別添4】

3. 審議後、JIS作成予定一覧表の公表（確認及び廃止）及び意見受付公告（廃止）によって、利害関係者の意向を確認します。

※ これによって利害関係者から意見等があった場合で、議決結果の変更又は意見等を採用しない場合は、再度、産業標準作成委員会にお諮りいたします。ただし、意見の提出がない、又は審議の結果に影響を与えない場合は  
4. 申出へと進みます。

4. 産業標準作成委員会で承認されたJISは、JSAから主務大臣へJISの確認及び廃止の申出を行います。

2024年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (補正、改正、 廃止又は “-”を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 0807:2020	一次元シンボル(バーコード)及び二次元シンボルを使用した電子部品用容器包装ラベル	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 4556:2009	工業用電子カウンタ	廃止	これから廃止に着手し、来年度中に廃止公示予定であるため。【廃止する理由】工業用電子カウンタ機器としては、IEC 61010を利用するのが一般的であるため。	6: 無(提未)対応国際規格が存在せず、今後の対応未定のもの。		一般社団法人 日本電気制御 機器工業会
JIS C 5064:2020	電子機器及び通信機器用固定インダクタ—表示記号	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-11-1:2014	電子機器用固定コンデンサ—第11-1部:ブランク個別規格:固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コンデンサ 評価水準E	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-11:2014	電子機器用固定コンデンサ—第11部:品種別通則:固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コンデンサ	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-14-1:2020	電子機器用固定コンデンサ—第14-1部:ブランク個別規格—電源用電磁障害防止固定コンデンサ—評価水準DZ	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-14-2:2020	電子機器用固定コンデンサ—第14-2部:ブランク個別規格—電源用電磁障害防止固定コンデンサ—安全性試験	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-15-1:1998	電子機器用固定コンデンサ—第15部:ブランク個別規格:はく電極形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価水準E	確認	対応国際規格は一部改訂されているが、JIS(MOD)は使用されており、規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-15-2:1998	電子機器用固定コンデンサ—第15部:ブランク個別規格:焼結形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価水準E	確認	対応国際規格は一部改訂されているが、JIS(MOD)は使用されており、規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-15-3:1998	電子機器用固定コンデンサ—第15部:ブランク個別規格:焼結形固定タンタル固体電解コンデンサ 評価水準E	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-15:1998	電子機器用固定コンデンサ—第15部:品種別通則:固定タンタル非固体又は固体電解コンデンサ	確認	対応国際規格は改訂されているが、JIS(MOD)は使用されており、規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-24-1:2009	電子機器用固定コンデンサ—第24-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定タンタル固体(導電性高分子)電解コンデンサ—評価水準E	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-25-1:2009	電子機器用固定コンデンサ—第25-1部:ブランク個別規格:表面実装用固定アルミニウム固体(導電性高分子)電解コンデンサ—評価水準E	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5101-8-1:2008	電子機器用固定コンデンサ—第8-1部:ブランク個別規格:固定磁器コンデンサ 種類1 評価水準E	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5160-2-1:2009	電子機器用固定電気二重層コンデンサ—第2-1部:ブランク個別規格—パワー用電気二重層コンデンサ—評価水準E	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5160-2:2009	電子機器用固定電気二重層コンデンサ—第2部:品種別通則—パワー用電気二重層コンデンサ	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5201-2-1:1998	電子機器用固定抵抗器—第2部:ブランク個別規格:低電力非巻線固定抵抗器 評価水準E	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5201-2:2014	電子機器用固定抵抗器—第2部:品種別通則:低電力皮膜固定抵抗器	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定であるため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5201-4-1:1998	電子機器用固定抵抗器—第4部:ブランク個別規格:電力形固定抵抗器 評価水準E	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5201-4:1998	電子機器用固定抵抗器—第4部:品種別通則:電力形固定抵抗器	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定であるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	最新 公示		主務大臣	専門委員会	参照文書 (JSA調査結果)			対応国際規格	対応国際規格の同等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日			対応国際規格	引用JIS	引用国際規格				
	種類	年月日	対応国際規格	引用JIS	引用国際規格						
JIS C 0807:2020	改正	2020/3/23	経産	電子技術	◎	×	◎	IEC 62090:2017	IDT	2005/12/20	2020/03/23
JIS C 4556:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	-	×	◎			1987/2/1	2009/12/21
JIS C 5064:2020	改正	2020/3/23	経産	電子技術	◎	◎	-	IEC 61605:2016	IDT	2009/7/20	2020/03/23
JIS C 5101-11-1:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60384-11-1:2008	IDT	1998/7/20	2014/09/22
JIS C 5101-11:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60384-11:2008	IDT	1998/7/20	2014/09/22
JIS C 5101-14-1:2020	改正	2020/3/23	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60384-14-1:2016	MOD	1998/7/20	2020/03/23
JIS C 5101-14-2:2020	改正	2020/3/23	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60384-14-2:2016	MOD	2009/2/20	2020/03/23
JIS C 5101-15-1:1998	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60384-15:1998/AMENDMENT 1:1987/IEC 60384-15-1:1984	MOD/MOD	1998/7/20	
JIS C 5101-15-2:1998	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60384-15:1982/AMENDMENT 1:1987/IEC 60384-15-2:1984	MOD/MOD	1998/7/20	
JIS C 5101-15-3:1998	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60384-15:1982/AMENDMENT 1:1987/IEC 60384-15-3:1984/AMENDMENT 1:1987	MOD/MOD	1998/7/20	
JIS C 5101-15:1998	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	×	IEC 60384-15:1982/AMENDMENT 1:1987	MOD	1998/7/20	
JIS C 5101-24-1:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60384-24-1:2006	IDT	2009/12/21	
JIS C 5101-25-1:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60384-25-1:2006	IDT	2009/12/21	
JIS C 5101-8-1:2008	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60384-8-1:2005	IDT	1998/7/20	2008/12/20
JIS C 5160-2-1:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 62391-2-1:2006	IDT	2009/7/20	
JIS C 5160-2:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 62391-2:2006	IDT	2009/7/20	
JIS C 5201-2-1:1998	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60115-2-1:1982	MOD	1998/7/20	
JIS C 5201-2:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60115-2:2014	IDT	1998/7/20	2014/11/20
JIS C 5201-4-1:1998	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60115-4-1:1983/AMENDMENT 1:1993	MOD	1998/7/20	
JIS C 5201-4:1998	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60115-4:1982/AMENDMENT 1:1993	MOD	1998/7/20	

参照文書の記号の説明:  
 ◎当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、  
 継続している。  
 ×当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、  
 改正及び/又は廃止されている(現状が不明なものも含む)。  
 -当該JISに参照文書がない。

2024年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (補正、改正、 廃止又は “-”を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 5201-5-1:1998	電子機器用固定抵抗器—第5部:ブランク個別規格:精密級固定抵抗器 評価水準E	確認	対応国際規格は廃止されているが、JIS(MOD)は使用されており、現時点で廃止の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5201-5:1998	電子機器用固定抵抗器—第5部:品種別通則:精密級固定抵抗器	確認	対応国際規格は廃止されているが、JIS(MOD)は使用されており、現時点で廃止の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5201-6-1:1999	電子機器用固定抵抗器—第6部:ブランク個別規格:個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器 同一抵抗値及び同一定格電力 評価水準E	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5201-6:1999	電子機器用固定抵抗器—第6部:品種別通則:個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5201-8-1:2014	電子機器用固定抵抗器—第8-1部:ブランク個別規格:一般電子機器向け表面実装用低電力皮膜固定抵抗器、製品性能水準G	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-1:2014	電子機器用可変抵抗器—第1部:品目別通則	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-2-1:2000	電子機器用可変抵抗器—第2部:ブランク個別規格:ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器 評価水準E	確認	国際規格は廃止されているが、JIS(MOD)は使用されており、現時点で廃止の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-2-2:2000	電子機器用可変抵抗器—第2部:ブランク個別規格:ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器 評価水準F	確認	国際規格は廃止されているが、JIS(MOD)は使用されており、現時点で廃止の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-2:2000	電子機器用可変抵抗器—第2部:品種別通則:ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器	確認	対応国際規格は改訂されているが、JIS(MOD)は使用されており、規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-3-1:2000	電子機器用可変抵抗器—第3部:ブランク個別規格:回転形精密級可変抵抗器 評価水準E	確認	これから廃止に着手し、廃止公示となるのが再来年度以降となるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-3:2000	電子機器用可変抵抗器—第3部:品種別通則:回転形精密級可変抵抗器	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-4-1:2000	電子機器用可変抵抗器—第4部:ブランク個別規格:単回転電力形可変抵抗器 評価水準E	確認	これから廃止に着手し、廃止公示となるのが再来年度以降となるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-4-2:2000	電子機器用可変抵抗器—第4部:ブランク個別規格:単回転電力形可変抵抗器 評価水準F	確認	これから廃止に着手し、廃止公示となるのが再来年度以降となるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-4:2000	電子機器用可変抵抗器—第4部:品種別通則:単回転電力形可変抵抗器	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-5-1:2000	電子機器用可変抵抗器—第5部:ブランク個別規格:単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器 評価水準E	確認	これから廃止に着手し、廃止公示となるのが再来年度以降となるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-5-2:2000	電子機器用可変抵抗器—第5部:ブランク個別規格:単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器 評価水準F	確認	これから廃止に着手し、廃止公示となるのが再来年度以降となるため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5260-5:2000	電子機器用可変抵抗器—第5部:品種別通則:単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器	確認	対応国際規格は改訂されているが、JIS(MOD)は使用されており、規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5310:1997	電子機器用電源変圧器品目別通則	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在せず、国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5311:1994	電子機器用電源変圧器試験方法	確認	対応国際規格は改訂されているが、JIS(NEQ)は使用されており、規定内容の変更の必要がないため。	3: NEQ		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5320:1994	電子機器用高周波コイル及び中間周波変成器通則	確認	規定内容の変更の必要がないため。	6: 無(提未)対応国際規格が存在せず、今後の対応未定のもの。		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5321:1997	電子機器用高周波コイル及び中間周波変成器試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	6: 無(提未)対応国際規格が存在せず、今後の対応未定のもの。		一般社団法人 電子情報技術 産業協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	最新 公示		主務大臣	専門委員会	参照文書 (JISA調査結果)			対応国際規格	引用国際規格	対応国際規格 の記号の説明: ◎当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、 継続している。 ×当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、 改正及び/又は廃止されている(現状が不明なものも含む)。 —当該JISに参照文書がない。	対応国際規格 の同 等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日			対 応 国 際 規 格	引 用 国 際 規 格							
							対 応 国 際 規 格						
JIS C 5201-5-1:1998	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60115-5-1:1983	MOD	1998/7/20			
JIS C 5201-5:1998	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	×	IEC 60115-5:1982	MOD	1998/7/20			
JIS C 5201-6-1:1999	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60115-6-1:1983	IDT	1999/2/20			
JIS C 5201-6:1999	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60115-6:1983/AMENDMENT 1:1987	MOD	1999/2/20			
JIS C 5201-8-1:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60115-8-1:2014	IDT	1998/7/20	2014/11/20		
JIS C 5260-1:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60393-1:2008	IDT	1999/2/20	2014/09/22		
JIS C 5260-2-1:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60393-2-1:1989	MOD	2000/4/20			
JIS C 5260-2-2:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60393-2-2:1992	MOD	2000/4/20			
JIS C 5260-2:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	×	IEC 60393-2:1989	MOD	2000/4/20			
JIS C 5260-3-1:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60393-3-1:1992	MOD	2000/9/20			
JIS C 5260-3:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60393-3:1992	MOD	2000/9/20			
JIS C 5260-4-1:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60393-4-1:1992	MOD	2000/9/20			
JIS C 5260-4-2:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60393-4-2:1992	MOD	2000/9/20			
JIS C 5260-4:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60393-4:1992	MOD	2000/9/20			
JIS C 5260-5-1:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60393-5-1:1992	MOD	2000/4/20			
JIS C 5260-5-2:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60393-5-2:1992	MOD	2000/4/20			
JIS C 5260-5:2000	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	×	IEC 60393-5:1992	MOD	2000/4/20			
JIS C 5310:1997	確認	2019/10/21	経産	電子技術	-	◎	×			1972/8/1	1997/02/20		
JIS C 5311:1994	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 61007:1990	NEQ	1974/9/1	1994/03/01		
JIS C 5320:1994	確認	2019/10/21	経産	電子技術	-	×	-			1972/10/1	1994/03/01		
JIS C 5321:1997	確認	2019/10/21	経産	電子技術	-	×	-			1973/8/1	1997/10/20		

2024年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、 廃止又は “-”を記入)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 5381-11:2014	低圧サージ防護デバイス—第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5381-21:2014	低圧サージ防護デバイス—第21部:通信及び信号回路に接続するサージ防護デバイス(SPD)の要求性能及び試験方法	確認	対応国際規格はEd1.2に改訂されているが、JIS改正の要望はなく、規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5401-4-001:2005	電子機器用コネクタ—第4-001部:プリント配線板用コネクタ—品質評価付—ブランク個別規格	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5401-4:2005	電子機器用コネクタ—第4部:品種別通則—プリント配線板用コネクタ—品質評価付	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-1-1:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第1-1部:一般試験—試験1a:外観	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-1-100:2014	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第1-100部:一般試験方法規格一覧	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-1-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第1-2部:一般試験—試験1b:寸法及び質量	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-10:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-10部:耐候性試験—試験1j:低温	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-11:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-11部:耐候性試験—試験1k:減圧	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-12:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-12部:耐候性試験—試験1m:温湿度サイクル	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-13:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-13部:耐候性試験—試験1n:ガスタイト・無はんだラッピング接続	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-2部:耐候性試験—試験1b:低温・減圧・湿度複合シークエンス	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-3部:耐候性試験—試験1c:高温高湿(定常)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-4:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-4部:耐候性試験—試験1d:温度急変	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-5:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-5部:耐候性試験—試験1e:かびの成長	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-6:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-6部:耐候性試験—試験1f:腐食、塩水噴霧	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-11-9:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-9部:耐候性試験—試験1i:高温	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-12-7:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-7部:はんだ付け試験—試験12g:はんだ付け性、平衡法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-13-5:2014	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第13-5部:機械的動作試験—試験13e:複性及びキーイング	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-15-1:2014	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第15-1部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15a:インサート内のコンタクト保持	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-15-4:2014	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第15-4部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15d:コンタクトの挿入、解放及び引抜き	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	最新 公示		主務大臣	専門委員会	参照文書 (JISA調査結果)			対応国際規格	対国際規格の同 等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日			対国際規格	引用JIS	引用国際規格				
	◎	×	◎	×	◎	×	◎				
JIS C 5381-11:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 61643-11:2011	IDT	2014/6/20	
JIS C 5381-21:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	×	IEC 61643-21:2009	IDT	2004/3/20	2014/06/20
JIS C 5401-4-001:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 61076-4-001:1996	IDT	2005/3/20	
JIS C 5401-4:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 61076-4:1995	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-1-1:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	IEC 60512-1-1:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-1-100:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	IEC 60512-1-100:2012	MOD	2002/3/20	2014/06/20
JIS C 5402-1-2:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	IEC 60512-1-2:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-10:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60512-11-10:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-11:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	◎	IEC 60512-11-11:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-12:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60512-11-12:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-13:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	-	IEC 60512-11-13:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-2:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	×	IEC 60512-11-2:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-3:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60512-11-3:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-4:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	◎	IEC 60512-11-4:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-5:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	×	IEC 60512-11-5:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-6:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	×	IEC 60512-11-6:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-11-9:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 60512-11-9:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-12-7:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60512-12-7:2001	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-13-5:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	◎	IEC 60512-13-5:2006	IDT	2014/6/20	
JIS C 5402-15-1:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	-	IEC 60512-15-1:2008	IDT	2014/6/20	
JIS C 5402-15-4:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	-	IEC 60512-15-4:2008	IDT	2014/6/20	

参照文書の記号の説明:  
 ◎当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、  
 継続している。  
 ×当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、  
 改正及び/又は廃止されている(現状が不明なものも含む)。  
 -当該JISに参照文書がない。

2024年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (補正、改正、 廃止又は “－”を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 5402-15-6:2014	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第15-6部:コネクタ試験(機械的試験)—試験15f:コネクタカップリング機構の効果	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-16-3:2014	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16-3部:コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16c:コンタクト曲げ強度	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-2-1:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-1部:導通及び接触抵抗試験—試験2a:接触抵抗—ミリボルトレベル法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-2-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-2部:導通及び接触抵抗試験—試験2b:接触抵抗—規定電流法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-2-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-3部:導通及び接触抵抗試験—試験2c:接触抵抗の変動	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-2-6:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-6部:導通及び接触抵抗試験—試験2f:ハウジング(シェル)の導通性	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-20-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第20-2部:耐火性試験—試験20b:耐火性	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-23-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第23-3部:スクリーニング及びフィルタリング試験—試験23c:コネクタ及びアクセサリのシールド効果	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-3-1:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第3-1部:絶縁試験—試験3a:絶縁抵抗	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-4-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第4-2部:電圧ストレス試験—試験4b:部分放電	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-4-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第4-3部:電圧ストレス試験—試験4c:耐電圧(絶縁被覆付クランプパレル)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-5-1:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第5-1部:電流容量試験—試験5a:温度上昇	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-5-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第5-2部:電流容量試験—試験5b:電流・温度の軽減	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-6-1:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-1部:動的ストレス試験—試験6a:加速度(定常)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-6-2:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-2部:動的ストレス試験—試験6b:ハンパ	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-6-3:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-3部:動的ストレス試験—試験6c:衝撃	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5402-6-4:2005	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-4部:動的ストレス試験—試験6d:正弦波振動	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5442:1996	制御用小形電磁リレーの試験方法	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を踏まえて検討する必要があるため。	3: NEQ		一般社団法人 日本電気制御 機器工業会
JIS C 5564:1991	磁気テープ録音再生システム 第3部 磁気テープ録音再生機器の特性測定方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5583:1992	8mmビデオ—8mm磁気テープヘリカル走査ビデオカセットシステム	確認	対応国際規格は改訂されているが、JIS改正の要望はなく、規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 5630-18:2014	マイクロマシン及びMEMS—第18部:薄膜曲げ試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 マイクロマシン センター

【JIS書誌情報】

規格番号及び 西暦年	最新 公示		主務 大臣	専門 委員会	参照文書 (JSA調査結果)			対応国際 規格	引用 JIS	引用 国際 規格	対応国際 規格	対応国際 規格の同 等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日			対 応	引 用	引 用							
JIS C 5402-15-6:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	-	◎	◎	-	IEC 60512-15-6:2008	IDT	2014/6/20	
JIS C 5402-16-3:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	-	◎	◎	-	IEC 60512-16-3:2008	IDT	2014/6/20	
JIS C 5402-2-1:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	◎	-	-	IEC 60512-2-1:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-2-2:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	◎	-	-	IEC 60512-2-2:2003	IDT	2005/12/20	
JIS C 5402-2-3:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	-	◎	◎	-	IEC 60512-2-3:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-2-6:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	◎	◎	◎	◎	IEC 60512-2-6:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-20-2:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	◎	-	-	IEC 60512-20-2:2000	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-23-3:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	x	-	x	x	-	x	IEC 60512-23-3:2000	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-3-1:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	◎	-	-	IEC 60512-3-1:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-4-2:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	x	◎	-	x	IEC 60512-4-2:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-4-3:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	◎	-	-	IEC 60512-4-3:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-5-1:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	-	◎	◎	-	IEC 60512-5-1:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-5-2:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	◎	-	-	IEC 60512-5-2:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-6-1:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	x	◎	◎	x	IEC 60512-6-1:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-6-2:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	x	x	◎	x	x	IEC 60512-6-2:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-6-3:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	x	x	◎	x	x	IEC 60512-6-3:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5402-6-4:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	x	x	◎	x	x	IEC 60512-6-4:2002	IDT	2005/3/20	
JIS C 5442:1996	確認	2019/10/21	経産	電子技術	x	x	-	x	x	-	IEC 60255-7:1991	NEQ	1978/9/1 1996/04/01	
JIS C 5564:1991	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	◎	-	-	IEC 60094-3:1979	IDT	1991/2/1	
JIS C 5583:1992	確認	2019/10/21	経産	電子技術	x	-	-	x	-	-	IEC 60843:1987	IDT	1992/7/1	
JIS C 5630-18:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	-	◎	◎	-	IEC 62047-18:2013	IDT	2014/12/22	

参照文書の記号の説明：  
 ◎当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、  
 継続している。  
 ×当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、  
 改正及び/又は廃止されている（現状が不明なものも含む）。  
 -当該JISに参照文書がない。



2024年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (補正、改正、 廃止又は “”を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 61191-2:2020	プリント配線板実装—第2部:部門規格—表面実装はんだ付け要求事項	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 61191-3:2020	プリント配線板実装—第3部:部門規格—挿入実装はんだ付け要求事項	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 61191-4:2020	プリント配線板実装—第4部:部門規格—端子実装はんだ付け要求事項	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 6121-5-2:2019	光増幅器—第5-2部:品質評価規格—光ファイバ増幅器の信頼性評価	確認	これから改正に着手し、改正公示となるのが再来年度以降となるため、確認する。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 6122-10-1:2020	光増幅器—測定方法—第10-1部:マルチチャネルパラメータ—光スイッチ及び光スペクトラムアナライザを用いたパルス法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 6122-10-2:2010	光増幅器—測定方法—第10-2部:マルチチャネルパラメータ—ゲート付き光スペクトラムアナライザを用いたパルス法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 6123-4:2015	光増幅器—性能仕様テンプレート—第4部:マルチチャネル用光増幅器	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-1:2019	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第1部:通則	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定であるため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-2-11:2015	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-11部:光ファイバクランプ強度試験(軸方向圧縮)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-2-14:2020	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-14部:高光パワー試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-2-18:2009	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-18部:高温試験	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定であるため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-2-45:2009	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-45部:浸水試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-2-48:2010	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-48部:温湿度サイクル試験	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-2-7:2015	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-7部:かん合部締結強度試験(曲げモーメント)	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-3-20:2009	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-20部:波長選択性のない光フランチングデバイスのデレクティビティ測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-3-25:2019	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-25部:直角端面フェルルル及び光ファイバ取付け直角端面フェルルルの同心度測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-3-3:2009	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-3部:挿入損失及び反射減衰量変化のモニタ方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 61300-3-40:2014	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-40部:偏波面保存光ファイバ付き光ファイバコネクタプラグの偏波消光比測定	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 62025-2:2009	高周波誘導部品—非電氣的特性及び測定方法—第2部:非電氣的特性の試験方法	確認	対応国際規格は改訂されているが、JIS改正の要望はなく、規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 62137-3:2014	電子実装技術—第3部:はんだ接合部耐久性試験方法の選定指針	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般社団法人 電子情報技術 産業協会

【JIS書誌情報】

規格番号及び西暦年	最新 公示		主務大臣	専門委員会	参照文書 (JISA調査結果)			対応国際規格	対国際規格の同 等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日			対国際規格	引用規格	引用規格				
	種類	年月日	対国際規格	引用規格	引用規格						
JIS C 61191-2:2020	改正	2020/3/23	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 61191-2:2017	IDT	2006/3/25	2020/03/23
JIS C 61191-3:2020	改正	2020/3/23	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 61191-3:2017	IDT	2006/3/25	2020/03/23
JIS C 61191-4:2020	改正	2020/3/23	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 61191-4:2017	IDT	2006/3/25	2020/03/23
JIS C 6121-5-2:2019	改正	2019/8/20	経産	電子技術	◎	×	◎	IEC 61291-5-2:2017/CORRIGENDUM 12019	IDT	2007/3/20	2019/08/20
JIS C 6122-10-1:2020	改正	2020/2/20	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 61290-10-1:2009	IDT	2007/3/20	2020/02/20
JIS C 6122-10-2:2010	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	◎	IEC 61290-10-2:2007	IDT	2010/3/23	
JIS C 6123-4:2015	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	◎	IEC 61291-4:2011	IDT	2008/1/20	2015/03/20
JIS C 61300-1:2019	改正	2019/6/20	経産	電子技術	×	×	×	IEC 61300-1:2016	IDT	2009/7/20	2019/06/20
JIS C 61300-2-11:2015	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 61300-2-11:2012	IDT	2015/3/20	
JIS C 61300-2-14:2020	改正	2020/2/20	経産	電子技術	×	◎	◎	IEC 61300-2-14:2012	IDT	2011/1/20	2020/02/20
JIS C 61300-2-18:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 61300-2-18:2005	IDT	2009/7/20	
JIS C 61300-2-45:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	IEC 61300-2-45:1999	IDT	2009/7/20	
JIS C 61300-2-48:2010	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	×	IEC 61300-2-48:2009	IDT	2010/3/23	
JIS C 61300-2-7:2015	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 61300-2-7:2013	IDT	2015/3/20	
JIS C 61300-3-20:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	IEC 61300-3-20:2001	IDT	2009/7/20	
JIS C 61300-3-25:2019	改正	2019/7/22	経産	電子技術	◎	-	-	IEC 61300-3-25:2016	IDT	2014/12/22	2019/07/22
JIS C 61300-3-3:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	×	IEC 61300-3-3:2003	IDT	2009/7/20	
JIS C 61300-3-40:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	-	-	IEC 61300-3-40:1998	IDT	2014/12/22	
JIS C 62025-2:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	×	IEC 62025-2:2005	IDT	2009/7/20	
JIS C 62137-3:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	◎	×	IEC 62137-3:2011	IDT	2014/9/22	

参照文書の記号の説明:  
 ◎当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、  
 継続している。  
 ×当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、  
 改正及び/又は廃止されている(現状が不明なものも含む)。  
 -当該JISに参照文書がない。

2024年度に見直し期限を迎えるJISの見直し(案)(電子分野)

別添2

規格番号	規格名称	公示予定 (確認、改正、 廃止又は “-”を入力)	左記理由	対応国際規格との整合	備考	素案作成団体
JIS C 62623:2014	パーソナルコンピュータの消費電力測定方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 6421:1994	放送受信機用中間周波変成器	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在 せず、国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 6435:1989	低周波変成器及びコイル試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	5: 無(提無)対応国際規格が存在 せず、国際規格に提案しないもの。		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 6760:2014	弾性表面波デバイス用単結晶ウェハー仕様及び測定法	確認	対応国際規格の改訂が予定されており、その動向を 踏まえて検討する必要があるため。	2: MOD		日本水晶デバ イス工業会
JIS C 6823:2010	光ファイバ損失試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 6824:2009	マルチモード光ファイバ帯域試験方法	改正	これから改正に着手し、来年度中に改正公示予定であ るため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 6827:2015	光ファイバ波長分散試験方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 6828:2019	光ファイバ構造パラメータ測定器校正方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 6829:2005	光ファイバ波長分散測定器校正方法	改正	改正に着手しており、来年度中に改正公示予定である ため。	1: IDT		一般財団法人 光産業技術振 興協会
JIS C 7030:1993	トランジスタ測定方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	3: NEQ		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 7031:1993	小信号用半導体ダイオード測定方法	確認	規定内容の変更の必要がないため。	2: MOD		一般社団法人 電子情報技術 産業協会
JIS C 9921-5:2009	テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)の設計上 の標準使用期間を設定するための標準使用条件	確認	規定内容の変更の必要がないため。	6: 無(提未)対応国際規格が存在 せず、今後の対応未定のもの。		一般社団法人 電子情報技術 産業協会

【JIS書誌情報】

書誌 情報				参 照 文 書 (JSA調査結果)			参照文書の記号の説明: ◎当該JIS発効時の参照文書のすべてが、改廃されずに、 存続している。 ×当該JIS発効時以降、参照文書の一部及び/又は全てが、 改正及び/又は廃止されている(現状が不明なものも含む)。 -当該JISに参照文書がない。				
規格番号及び 西暦年	最新 公示		主務 大臣	専門 委員会	対応 国際 規格	引用 JIS	引用 国際 規格	対応国際規格	対応国際 規格の同 等性	制定年月日	最新改正日
	種類	年月日									
JIS C 62623:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	-	-	IEC 62623:2012	MOD	2014/12/22	
JIS C 6421:1994	確認	2019/10/21	経産	電子技術	-	×	-			1950/7/28	1994/03/01
JIS C 6435:1989	確認	2019/10/21	経産	電子技術	-	×	-			1953/11/7	1989/11/01
JIS C 6760:2014	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 62276:2012	MOD	2014/6/20	
JIS C 6823:2010	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60793-1- 1:2008;IEC 60793-1- 40:2001;IEC 60793-1- 46:2001;IEC 60793-1	MOD;MOD;M	1989/1/1	2010/03/23
JIS C 6824:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	×	IEC 60793-1- 41:2003	MOD	1989/1/1	2009/12/21
JIS C 6827:2015	確認	2019/10/21	経産	電子技術	◎	×	-	IEC 60793-1- 42:2013	MOD	1989/1/1	2015/03/20
JIS C 6828:2019	改正	2019/11/20	経産	電子技術	◎	-	-	IEC 61745:2017	IDT	2004/3/20	2019/11/20
JIS C 6829:2005	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	×	IEC 61744:2001	IDT	2005/1/20	
JIS C 7030:1993	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60747- 7:1980;IEC 60747- 8:1984	NEQ;NEQ	1961/6/1	1993/02/01
JIS C 7031:1993	確認	2019/10/21	経産	電子技術	×	×	-	IEC 60747-3:1985	MOD	1963/9/1	1993/02/01
JIS C 9921-5:2009	確認	2019/10/21	経産	電子技術	-	-	-			2009/3/20	

日本産業規格作成審議経過報告書（確認）

**1. 確認の申出を行う日本産業規格**

JIS C 0807 一次元シンボル（バーコード）及び二次元シンボルを使用した電子部品用容器  
包装ラベル 外 1 2 5 件（別紙 1 のとおり）

**2. 確認の申出を行う日本産業規格に係る主務大臣**

経済産業大臣専管

**3. 確認の理由**

別紙 1 の日本産業規格は、産業標準化法第 17 条の規定による見直し期限を 2024 年度に迎えるものであるが、認定産業標準作成機関として、関係各方面の意見を調査し検討した結果、現行の日本産業規格がなお適正であると認められることから、確認すべきものとして申出する。

**4. 確認の申出を行う日本産業規格の作成及び審議に関する事項**

(1) 認定産業標準作成機関名；一般財団法人日本規格協会（JSA）

(2) 法令上の区分；

産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項に基づく申出

(3) 産業標準作成委員会名；

電子分野産業標準作成委員会

(4) 産業標準作成委員会の委員構成表及び開催状況；

別紙 2 に記載のとおり。

(5) 作成審議経過

別紙 2 に記載のとおり。

以上

## 確認の申出を行う日本産業規格

No.	規格番号	規格名称
1	C0807	一次元シンボル（バーコード）及び二次元シンボルを使用した電子部品用容器包装ラベル
2	C5064	電子機器及び通信機器用固定インダクタ—表示記号
3	C5101-11-1	電子機器用固定コンデンサ—第11-1部：ブランク個別規格：固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コンデンサ 評価水準E Z
4	C5101-11	電子機器用固定コンデンサ—第11部：品種別通則：固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コンデンサ
5	C5101-14-1	電子機器用固定コンデンサ—第14-1部：ブランク個別規格—電源用電磁障害防止固定コンデンサ—評価水準 D Z
6	C5101-14-2	電子機器用固定コンデンサ—第14-2部：ブランク個別規格—電源用電磁障害防止固定コンデンサ—安全性試験
7	C5101-15-1	電子機器用固定コンデンサ—第15部：ブランク個別規格：はく電極形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価水準E
8	C5101-15-2	電子機器用固定コンデンサ—第15部：ブランク個別規格：焼結形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価水準E
9	C5101-15-3	電子機器用固定コンデンサ—第15部：ブランク個別規格：焼結形固定タンタル固体電解コンデンサ 評価水準E
10	C5101-15	電子機器用固定コンデンサ—第15部：品種別通則：固定タンタル非固体又は固体電解コンデンサ
11	C5101-24-1	電子機器用固定コンデンサ—第24-1部：ブランク個別規格：表面実装用固定タンタル固体（導電性高分子）電解コンデンサ—評価水準E Z
12	C5101-25-1	電子機器用固定コンデンサ—第25-1部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コンデンサ—評価水準E Z
13	C5101-8-1	電子機器用固定コンデンサ—第8-1部：ブランク個別規格：固定磁器コンデンサ 種類1 評価水準E Z
14	C5160-2-1	電子機器用固定電気二重層コンデンサ—第2-1部：ブランク個別規格—パワー用電気二重層コンデンサ—評価水準E Z
15	C5160-2	電子機器用固定電気二重層コンデンサ—第2部：品種別通則—パワー用電気二重層コンデンサ
16	C5201-2-1	電子機器用固定抵抗器—第2部：ブランク個別規格：低電力非巻線固定抵抗器 評価水準E
17	C5201-4-1	電子機器用固定抵抗器—第4部：ブランク個別規格：電力形固定抵抗器 評価水準E
18	C5201-5-1	電子機器用固定抵抗器—第5部：ブランク個別規格：精密級固定抵抗器 評価水準E
19	C5201-5	電子機器用固定抵抗器—第5部：品種別通則：精密級固定抵抗器
20	C5201-6-1	電子機器用固定抵抗器—第6部：ブランク個別規格：個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器 同一抵抗値及び同一定格電力 評価水準E
21	C5201-6	電子機器用固定抵抗器—第6部：品種別通則：個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器
22	C5201-8-1	電子機器用固定抵抗器—第8-1部：ブランク個別規格：一般電子機器向け表面実装用低電力皮膜固定抵抗器，製品性能水準G
23	C5260-1	電子機器用可変抵抗器—第1部：品目別通則
24	C5260-2-1	電子機器用可変抵抗器—第2部：ブランク個別規格：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器 評価水準E

25	C5260-2-2	電子機器用可変抵抗器—第2部：ブランク個別規格：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器 評価水準F
26	C5260-2	電子機器用可変抵抗器—第2部：品種別通則：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器
27	C5260-3-1	電子機器用可変抵抗器—第3部：ブランク個別規格：回転形精密級可変抵抗器 評価水準E
28	C5260-3	電子機器用可変抵抗器—第3部：品種別通則：回転形精密級可変抵抗器
29	C5260-4-1	電子機器用可変抵抗器—第4部：ブランク個別規格：単回転電力形可変抵抗器 評価水準E
30	C5260-4-2	電子機器用可変抵抗器—第4部：ブランク個別規格：単回転電力形可変抵抗器 評価水準F
31	C5260-4	電子機器用可変抵抗器—第4部：品種別通則：単回転電力形可変抵抗器
32	C5260-5-1	電子機器用可変抵抗器—第5部：ブランク個別規格：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器 評価水準E
33	C5260-5-2	電子機器用可変抵抗器—第5部：ブランク個別規格：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器 評価水準F
34	C5260-5	電子機器用可変抵抗器—第5部：品種別通則：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器
35	C5310	電子機器用電源変圧器品目別通則
36	C5311	電子機器用電源変圧器試験方法
37	C5320	電子機器用高周波コイル及び中間周波変成器通則
38	C5321	電子機器用高周波コイル及び中間周波変成器試験方法
39	C5381-11	低圧サージ防護デバイス—第11部：低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法
40	C5381-21	低圧サージ防護デバイス—第21部：通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス（SPD）の要求性能及び試験方法
41	C5401-4-001	電子機器用コネクタ—第4-001部：プリント配線板用コネクタ—品質評価付—ブランク個別規格
42	C5401-4	電子機器用コネクタ—第4部：品種別通則—プリント配線板用コネクタ—品質評価付
43	C5402-1-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第1-1部：一般試験—試験1a：外観
44	C5402-1-100	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第1-100部：一般—試験方法規格一覧
45	C5402-1-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第1-2部：一般試験—試験1b：寸法及び質量
46	C5402-11-10	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-10部：耐候性試験—試験11j：低温
47	C5402-11-11	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-11部：耐候性試験—試験11k：減圧
48	C5402-11-12	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-12部：耐候性試験—試験11m：温湿度サイクル
49	C5402-11-13	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-13部：耐候性試験—試験11n：ガスタイト・無はんだラッピング接続
50	C5402-11-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-2部：耐候性試験—試験11b：低温・減圧・湿度複合シーケンス
51	C5402-11-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-3部：耐候性試験—試験11c：高温高湿（定常）
52	C5402-11-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-4部：耐候性試験—試験11d：温度急変
53	C5402-11-5	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-5部：耐候性試験—試験11e：かびの成長

54	C5402-11-6	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-6部：耐候性試験—試験11f：腐食，塩水噴霧
55	C5402-11-9	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第11-9部：耐候性試験—試験11i：高温
56	C5402-12-7	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第12-7部：はんだ付け試験—試験12g：はんだ付け性，平衡法
57	C5402-13-5	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第13-5部：機械的動作試験—試験13e：極性及びキーイング
58	C5402-15-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第15-1部：コネクタ試験（機械的試験）—試験15a：インサート内のコンタクト保持
59	C5402-15-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第15-4部：コネクタ試験（機械的試験）—試験15d：コンタクトの挿入，解放及び引抜力
60	C5402-15-6	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第15-6部：コネクタ試験（機械的試験）—試験15f：コネクタカップリング機構の効果
61	C5402-16-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第16-3部：コンタクト及びターミネーションの機械的試験—試験16c：コンタクト曲げ強度
62	C5402-2-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-1部：導通及び接触抵抗試験—試験2a：接触抵抗—ミリボルトレベル法
63	C5402-2-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-2部：導通及び接触抵抗試験—試験2b：接触抵抗—規定電流法
64	C5402-2-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-3部：導通及び接触抵抗試験—試験2c：接触抵抗の変動
65	C5402-2-6	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第2-6部：導通及び接触抵抗試験—試験2f：ハウジング（シェル）の導通性
66	C5402-20-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第20-2部：耐火性試験—試験20b：耐火性
67	C5402-23-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第23-3部：スクリーニング及びフィルタリング試験—試験23c：コネクタ及びアクセサリのシールド効果
68	C5402-3-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第3-1部：絶縁試験—試験3a：絶縁抵抗
69	C5402-4-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第4-2部：電圧ストレス試験—試験4b：部分放電
70	C5402-4-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第4-3部：電圧ストレス試験—試験4c：耐電圧（絶縁被覆付クリンパレル）
71	C5402-5-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第5-1部：電流容量試験—試験5a：温度上昇
72	C5402-5-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第5-2部：電流容量試験—試験5b：電流・温度の軽減
73	C5402-6-1	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-1部：動的ストレス試験—試験6a：加速度（定常）
74	C5402-6-2	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-2部：動的ストレス試験—試験6b：バンプ
75	C5402-6-3	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-3部：動的ストレス試験—試験6c：衝撃
76	C5402-6-4	電子機器用コネクタ—試験及び測定—第6-4部：動的ストレス試験—試験6d：正弦波振動
77	C5442	制御用小形電磁リレーの試験方法
78	C5564	磁気テープ録音再生システム 第3部 磁気テープ録音再生機器の特性測定方法
79	C5583	8mmビデオ—8mm磁気テープヘリカル走査ビデオカセットシステム
80	C5630-18	マイクロマシン及びMEMS—第18部：薄膜曲げ試験方法

81	C5630-19	マイクロマシン及びMEMS—第19部：電子コンパス
82	C5877-1	偏光子—第1部：通則
83	C5900	光伝送用受動部品通則
84	C5910-3	波長選択性のない光ブランディングデバイス—第3部：シングルモード光ファイバピグテール形1×N及び2×N光ブランディングデバイス
85	C5921	シングルモード光ファイバピグテール型固定光減衰器
86	C5935	光伝送用レンズ試験方法
87	C5946	光ファイバ増幅器用半導体レーザモジュール通則
88	C5947	光ファイバ増幅器用半導体レーザモジュール測定方法
89	C5964-13	光ファイバコネクタかん合標準—第13部：FC-PC形光ファイバコネクタ類（F01形）
90	C5964-18	光ファイバコネクタかん合標準—第18部：MT-RJコネクタ類（F19形）
91	C5964-20	光ファイバコネクタかん合標準—第20部：LC形光ファイバコネクタ類
92	C5970	F01形単心光ファイバコネクタ（FCコネクタ）
93	C5982	F13形多心光ファイバコネクタ（MPOコネクタ）
94	C5988	F19形光ファイバコネクタ（MT-RJコネクタ）
95	C60068-2-58	環境試験方法—電気・電子—第2-58部：表面実装部品（SMD）のはんだ付け性、電極の耐はんだ食われ性及びはんだ耐熱性試験方法
96	C60068-2-83	環境試験方法—電気・電子—第2-83部：試験Tf—ソルダペーストを用いた平衡法による表面実装部品（SMD）のはんだ付け性試験方法
97	C6010-2	電子機器用ラック及びユニットシャシのモジュラオーダー—第2部：25mm実装のインタフェース整合寸法
98	C61188-7	プリント配線板及びプリント配線板実装—設計及び使用—第7部：CADライブラリに用いる電子部品の基準点及び配置方向
99	C61191-2	プリント配線板実装—第2部：部門規格—表面実装はんだ付け要求事項
100	C61191-3	プリント配線板実装—第3部：部門規格—挿入実装はんだ付け要求事項
101	C61191-4	プリント配線板実装—第4部：部門規格—端子実装はんだ付け要求事項
102	C6121-5-2	光増幅器—第5-2部：品質評価規格—光ファイバ増幅器の信頼性評価
103	C6122-10-1	光増幅器—測定方法—第10-1部：マルチチャネルパラメータ—光スイッチ及び光スペクトラムアナライザを用いたパルス法
104	C6122-10-2	光増幅器—測定方法—第10-2部：マルチチャネルパラメータ—ゲート付き光スペクトラムアナライザを用いたパルス法
105	C6123-4	光増幅器—性能仕様テンプレート—第4部：マルチチャネル用光増幅器
106	C61300-2-11	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-11部：光ファイバクランプ強度試験（軸方向圧縮）
107	C61300-2-14	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-14部：高光パワー試験
108	C61300-2-45	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-45部：浸水試験
109	C61300-2-48	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-48部：温湿度サイクル試験
110	C61300-2-7	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第2-7部：かん合部締結強度試験（曲げモーメント）
111	C61300-3-20	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-20部：波長選択性のない光ブランディングデバイスのディレクティブティ測定
112	C61300-3-25	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-25部：直角端面フェルル及び光ファイバ取付け直角端面フェルルの同心度測定

113	C61300-3-3	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-3部：挿入損失及び反射減衰量変化のモニタ方法
114	C61300-3-40	光ファイバ接続デバイス及び光受動部品—基本試験及び測定手順—第3-40部：偏波面保存光ファイバ付き光ファイバコネクタプラグの偏波消光比測定
115	C62025-2	高周波誘導部品—非電気的特性及び測定方法—第2部：非電気的特性の試験方法
116	C62137-3	電子実装技術—第3部：はんだ接合部耐久性試験方法の選定指針
117	C62623	パーソナルコンピュータの消費電力測定方法
118	C6421	放送受信機用中間周波変成器
119	C6435	低周波変成器及びコイル試験方法
120	C6760	弾性表面波デバイス用単結晶ウェハ—仕様及び測定法
121	C6823	光ファイバ損失試験方法
122	C6827	光ファイバ波長分散試験方法
123	C6828	光ファイバ構造パラメータ測定器校正方法
124	C7030	トランジスタ測定方法
125	C7031	小信号用半導体ダイオード測定方法
126	C9921-5	テレビジョン受信機（ブラウン管のものに限る）の設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件

## 1. 産業標準作成委員会の委員構成表

## 1. 1 電子分野産業標準作成委員会構成員名簿

	氏名	所属	種別
(委員長)	平本 俊郎	東京大学	中立者
(委員)	西城 武志	総務省 国際戦略局 通信規格課	
	藤井 哲郎	東京都市大学	
	山田 誠	大阪公立大学	
	渋谷 隆	株式会社白山	生産者
	諏訪 正樹	KOA株式会社	
	石井 紀彦	日本放送協会	使用者
	河村 真紀子	主婦連合会	
	内藤 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会	
	松井 隆	日本電信電話株式会社	
(関係者)	内藤 智男	経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課	—
(事務局)	鐘築 利仁	一般財団法人日本規格協会	
	桑原 克佳	一般財団法人日本規格協会	
	清水 祐貴	一般財団法人日本規格協会	

## 2. 委員会開催状況

開催年月日	委員会区分	出席者数又は回答者数(名)
2023年12月XX日(予定)	産業標準作成委員会	〇/10

## 3. 作成審議経過(予定)

- ①産業標準案作成対象テーマの審議(JIS見直しの審議)、並びに産業標準案の作成及び審議(確認の申出に係る審議);

2023年12月XX日 産業標準作成委員会議決

- ②JIS作成予定一覧表の公表;

2023年12月XX日~申出予定日(2024年2月下旬)までJSAウェブサイト掲載

- ③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保;

2023年12月XX日~申出予定日(2024年2月下旬)までJSAウェブサイト掲載

- ④異議申立ての機会の確保;

2023年12月XX日~申出予定日(2024年2月下旬)までJSAウェブサイト掲載

- ⑤議事録及び委員会資料の公開;

2023年12月XX日 JSAウェブサイト掲載

## 4. 利害関係者の産業標準作成委員会への参加に関する内容(予定)

参加: 無

## 5. 異議申立てに関する内容及び結果(予定)

異議申立ての有無: 無

## 産業標準案作成経過報告書（廃止）

**1. 日本産業規格の番号及び名称**

規格番号 JIS C 4556

規格名称 工業用電子カウンタ

**2. 主務大臣**

経済産業大臣

**3. 廃止の理由等に関する事項**

## (1) 廃止の理由

工業用電子カウンタ機器としては、IEC 61010を利用するのが一般的であるため。

## (2) 廃止となる規格の移行先がある場合には、移行先の規格番号

無

## (3) 強制法規・公共調達基準等への引用

無

## (4) JISマーク表示制度の適用の有無

無

**4. 産業標準案作成に関する事項**

## (1) 産業標準案作成状況

認定産業標準作成機関 一般財団法人日本規格協会（JSA）

## (2) 産業標準作成委員会名

電子分野産業標準作成委員会

## (3) 産業標準作成委員会構成

- |             |    |
|-------------|----|
| a. 生産者側委員   | 2名 |
| b. 使用消費者側委員 | 4名 |
| c. 販売側委員    | -名 |
| d. 中立者側委員   | 4名 |

備考）産業標準作成委員会の構成表及び開催状況（WGがある場合は、WGを含む。）並びに作成審議経過（別紙に記載のとおり）

1. 産業標準案名  
工業用電子カウンタ

2. 産業標準作成委員会の構成表

2. 1 電子分野産業標準作成委員会

	氏名	所属	種別
(委員長)	平本 俊郎	東京大学	中立者
(委員)	西城 武志	総務省 国際戦略局 通信規格課	
	藤井 哲郎	東京都市大学	
	山田 誠	大阪公立大学	
	渋谷 隆	株式会社白山	生産者
	諏訪 正樹	KOA株式会社	使用者
	石井 紀彦	日本放送協会	
	河村 真紀子	主婦連合会	
	内藤 恵美子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会	
	松井 隆	日本電信電話株式会社	
(関係者)	内藤 智男	経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課	—
(事務局)	鐘築 利仁	一般財団法人日本規格協会	
	桑原 克佳	一般財団法人日本規格協会	
	清水 祐貴	一般財団法人日本規格協会 TPM	

3. 委員会開催状況

開催年月日	委員会区分	出席者数(名)
2023年12月XX日(予定)	産業標準作成委員会	〇/10

4. 作成審議経過(予定)

- ①産業標準案作成対象テーマの審議、並びに  
産業標準案の作成及び審議；  
2023年12月XX日 産業標準作成委員会議決
- ②JIS作成予定一覧表の公表；  
2023年12月XX日～申出予定日(2024年7月上旬)までJSAウェブサイト掲載
- ③利害関係者の産業標準作成委員会への参加の確保；  
2023年12月XX日～申出予定日(2024年7月上旬)までJSAウェブサイト掲載
- ④異議申立ての機会の確保；  
2023年12月XX日～申出予定日(2024年7月上旬)までJSAウェブサイト掲載
- ⑤意見受付公告；  
2023年12月XX日～2023年2月XX日までJSAウェブサイト掲載
- ⑥議事録及び委員会資料の公開；  
2023年12月XX日 JSAウェブサイト掲載

5. 利害関係者の産業標準作成委員会への参加に関する内容(予定)

参加： 無

6. 異議申立てに関する内容及び結果(予定)

異議申立ての有無： 無

7. 意見受付公告に関する内容及び結果(予定)

意見受付の有無： 無